# 業 解説

# 磁場印加型レーザーイオン源の開発と 高フラックス化に向けた検討

# Study on High-Flux Laser Ion Source with Applying Magnetic Field

高橋一匡,岡村昌宏<sup>1)</sup>

TAKAHASHI Kazumasa and OKAMURA Masahiro<sup>1)</sup> 長岡技術科学大学,<sup>1)</sup>ブルックヘブン国立研究所 (原稿受付:2018年2月21日)

レーザーイオン源は固体ターゲットに高強度(10<sup>8</sup> W/cm<sup>2</sup>~)のパルスレーザーを照射することによりアブ レーションプラズマを生成し、そこにイオンを引き出して加速するための外部電場を印加することで高輝度のイ オンビームを供給する技術である.また、アブレーションプラズマに対してさらに外部磁場を印加することでイオ ンフラックスの増加や電流波形の制御が可能となる.本稿ではレーザーイオン源の基本的な特徴、磁場を用いた レーザーイオン源の制御に関する研究の最近の動向について紹介する.

#### Keywords:

laser ion source, heavy ion beam, ablation plasma, high current beam, highly charged beam, solenoid magnetic field, multicusp magnetic field

#### 1. はじめに

昨今,重イオンビーム慣性核融合(HIF)のインジェク ター開発を目的としたレーザーイオン源の研究が行われて いる.HIFでは、核融合の条件を満たすために提案されて いるビームの仕様はいずれも既存の加速器技術で達成され たものよりも厳しく, 核融合燃料ターゲットへの最終照射 点で1 MJ の投入エネルギーを仮定すると、10 GeV のエネ ルギーを持つ 0.1 mC のビーム電荷をターゲットが爆縮す る時間スケールの10 ns 程度で照射する必要がある.これ を実現するビーム電流は10kAと極めて大きな値にな り、加速器によるビーム輸送の観点からはあまり現実的で はない. 過去に HIF のための様々な加速器システムが提案 されてきたが、加速時のビーム電流の要求を緩和するた め、いずれも加速中にビームの縦方向圧縮を取り入れ、イ オン源ではより長パルスで低い電流で済むようなスキーム が検討されている[1]. 例えば誘導加速器をベースにした 重イオン加速器システムの案の一つは、イオン源において 20 µs のビームパルス幅を仮定すると, 100 A のビーム電流 を必要としている. それでもなお, 要求される電流は単一 のイオン源によって供給,輸送する値としてはかなり大き い.したがって、複数のイオン源からなるフロントエンド を使用し、合計のビーム電流が100Aとなるような加速器 の構成が想定されている.この時、個々のイオン源は加速 器システムを単純化するためにできるだけ高いビーム電流 を供給することが要求される. さらに、加速器要素のサイ ズを小さくするためには、横方向のビームサイズが小さい ことが重要であり,ビームエミッタンスは,HIF 発電プラ ントの実現にとって重要な鍵である.よって HIF 用のイオ ン源は,パルス動作モードで大きなビーム電流と低いエ ミッタンスを有する高輝度ビームを供給しなければならな い.また,ビームを大電流化するためには,イオンフラッ クス(単位時間・単位面積あたりに通過するイオン数)を 高める必要がある.この要求を満たすために,我々はレー ザーイオン源の利用が最も有望な解決策であると考えてい る.

歴史を紐解くと最初のレーザーイオン源はレーザーが 1960年に発明されて10年以内に提案されており[2],レー ザーイオン源はレーザーの最も古い用途の1つであった. 固体ターゲットに高強度レーザーを照射することで生成さ れたアブレーションプラズマの特徴としてターゲットの面 と垂直方向に大きなドリフト速度を有し,従来のイオン源 と比較してプラズマ生成時の密度が高いため,レーザーイ オン源は大電流のイオンビームを比較的容易に生成可能で ある. さらに磁場印加型レーザーイオン源では,生成した アブレーションプラズマを磁場により制御することで,ア ブレーションプラズマの膨張を抑制し,HIFに要求される 大電流イオンビームの実現が期待できる.

レーザーを用いるイオン源として,近年,超高強度レー ザーのターゲットへの照射時に形成されるシースの電場に よりイオンの加速を行うレーザーイオン加速が発展してき ているが,本稿ではこれらに比較して集光強度の小さい (10<sup>8</sup> W/cm<sup>2</sup>~)レーザー照射によりアブレーションプラ

Nagaoka University of Technology, Nagaoka, NIIGATA 940-2188, Japan

corresponding author's e-mail: kazumasa@vos.nagaokaut.ac.jp

ズマを生成し,そこにイオンを引き出して加速するための 外部電場を印加してビームを引き出すレーザーイオン源に ついて紹介する.

## 2. レーザーイオン源

#### 2.1 レーザーイオン源の特徴

典型的なレーザーイオン源は、レーザーと光学系、ター ゲットおよびビーム引出電極からなる (図1). レーザー 照射によって生成されたアブレーションプラズマはター ゲットの表面の垂直方向に対し20~30度程度の角度に集中 して噴出する. プラズマからのイオンビームの引き出しは 一般的なイオン源ではBohm 電流とChild Langmuirの法則 から求まる空間電荷制限電流のバランスによって決定され る.しかし、アブレーションプラズマ中のイオンは温度よ り大きな運動エネルギーを有しており、イオンの音速より ドリフト速度の方が大きいために、引き出されるビーム電 流はイオン音速で決まるボーム電流ではなくイオンのドリ フト速度vを用いたJ = Zenvで求めることができる[3]. ここで, J は電流密度, Z, e, n はそれぞれイオン価数,素 電荷,およびイオン密度を表している.また,静的なプラ ズマから引き出される場合の電流密度は通常, Child Langmuir の法則から

$$J = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2q}{m}} \frac{V_a^{3/2}}{d^2} \tag{1}$$

のように表されるのに対し,レーザーイオン源ではレー ザーアブレーションプラズマがドリフト速度を有している ため,イオンの初速の影響により

$$J = \frac{4}{9} \varepsilon_0 \sqrt{\frac{2q}{m}} \frac{(\sqrt{V_0} + \sqrt{V_0 + V_a})^3}{d^2}$$
(2)

のようになる[4-6]. ここで, $\epsilon_0$ は真空の誘電率,q,m, *d*はそれぞれイオンの電荷,質量及び電極間の距離であり, *Va*は加速電圧,*V*<sub>0</sub>は $qV_0$ がプラズマ中の粒子が有する運動 エネルギーに相当する電圧である.これらのプラズマのド リフト速度の効果により,レーザーイオン源では静止した プラズマからイオンビームを引き出すよりも多くのイオン を供給できるポテンシャルを有している.

#### 2.2 電流とパルス幅

レーザーイオン源はパルスレーザーを用いてプラズマを

生成するため、得られるビームもパルス状である、ここで、 各イオンの振る舞いに注目すると、 プラズマの膨張時間 µs~に対してレーザー照射によるプラズマ加熱の時間(約 10 ns) は十分小さく,形成されたプラズマの初期のサイズ は、ドリフト距離と比較して無視できるので、プラズマの 膨張はレーザーターゲット表面の空間の一点から始まると 見なすことができる.そして、プラズマ中の各イオンは一 定速度で直進するためイオンビーム引き出し地点における 最も速いイオンと最も遅いイオンの到着時間の差によりイ オンビームのパルス幅が決定され、パルス幅はプラズマの ターゲットから引出電極までのドリフト距離に比例して増 加する.このように、レーザー照射の時間は非常に短いが、 引き出されたイオンビームのパルス幅は us 以上のスケー ルまで拡大することができる.また、電流値も輸送距離と ともに変化し、プラズマの3次元的な膨張に伴い、ドリフ ト距離の3乗に反比例して減少する.典型的な電流密度と してはターゲットから数10cmのドリフト後において 10~100 mA/cm<sup>2</sup> 程度を有しており、大きな電流を引き出 すことが可能である.

#### 2.3 価数

レーザーイオン源の価数はレーザーパワー密度と密接に 関わっている.パワー密度を増加させれば多価イオンを供 給可能であり,これは,集光レンズの焦点距離や位置に よって容易に調整可能である.CO<sub>2</sub>レーザーは比較的高い エネルギーを得ることができ,高い価数のイオンを得る条 件である高温のプラズマを生成しやすいため,これを用い たレーザーイオン源による多価イオンビームの供給が行わ れてきた.たとえばエネルギー,パワー密度がそれぞれ数 10-100 J,10<sup>12</sup>-10<sup>13</sup> W/cm<sup>2</sup> オーダーの条件で20価を超え る Ta,Pb イオンを得ることができる[7-10].また,数J の Nd:YAG レーザーを用いて10<sup>13</sup> W/cm<sup>2</sup> のオーダーの レーザー照射で10数価の金属イオンが生成されている [11].逆にパワー密度を10<sup>9</sup> W/cm<sup>2</sup> 以下に抑えることで1 価イオンが支配的なプラズマを生成可能である[12].

#### 2.4 エミッタンス

イオンビームの収束性を決める質の評価はエミッタンス という物理量によって議論される.一般にイオン源のエ ミッタンスはプラズマの温度の関数となっており,温度が 低いプラズマから引き出すほど質の良い低エミッタンスの ビームが形成可能である.レーザーイオン源ではプラズマ



は一点から膨張するため本質的には低エミッタンスのビー ムを形成できる.また,エミッタンスはプラズマに印加さ れる磁場によっても増加するが,重イオンビームで最も普 及している ECR イオン源は引き出し付近に強力な磁場が あり,エミッタンスが大きくなるため,ビームの輝度が上 げにくいという問題がある.これは Electron Beam Ion Source (EBIS) も同様であるが,レーザーイオン源にはこ の問題がないこともメリットである.一方で,レーザーイ オン源のビーム電流波形は shifted-Maxwell 分布を有する パルス状であり,これがプラズマとイオンビームの引き出 し面のメニスカスを時間変化させることで,エミッタンス が時間的に変動することが示されている[13].

#### 2.5 ターゲット

要がある.

全ての固体材料は、レーザー照射によってイオン化する ことができるため、他のイオン源とは異なり、レーザーイ オン源はヘリウム以外の非常に多様な種のイオンビームを 供給することができる.ブルックヘブン国立研究所 (BNL)では、レーザーイオン源からユーザー施設にLi,B, C,O,Al,Ca,Si,Ti,Fe,Zr,NbおよびAuを供給し ている.HとOのビームは、Zr水素化物とアルミナのター ゲットから得ることができ、また、冷凍機ヘッドを使用し て冷凍NeおよびArターゲットから良好なビームを得る方 法を実証している[14-17].

#### 3. ソレノイド磁場印加型レーザーイオン源 3.1 イオンビームの大電流化

我々がレーザーイオン源を設計するとき,求められる価 数のイオンを生成するようにレーザーパワー密度を調整 し,これによりプラズマ全体のターゲット表面に対するプ ラズマ膨張速度およびドリフト速度も決定される.その後 イオンビームのパルス長が選択されると,ターゲットとイ オンビームを引き出す電極との間の距離,すなわちプラズ マのドリフト距離が決定される.レーザーイオン源により 比較的長い (10 μs-100 μs オーダー)パルス幅のビームを 形成する際にはプラズマを長距離にわたって膨張させる必

先述のようにプラズマのドリフト距離を長くすると、よ り長いビームパルス幅が得られるが、プラズマが3次元的 に膨張するので、ビーム引き出し点におけるプラズマ密度 はドリフト距離の3乗に反比例する。例えば、イオンビー ムのパルス長を2倍にしたい場合、ドリフト距離を2倍に する必要があり、得られるビーム電流は1/8に減少する. この急峻なビーム電流の減少を補償するために、図2のよ うな長手方向のソレノイド磁場が非常に有効である. 典型 的には、数10 Gaussの静的なソレノイド磁場を印加するこ とにより、イオンビームの電流を磁場のない場合と比較し て容易に増加させることができる(図3).また,図4は 1mのソレノイドを用いて Cu ターゲットから発生したプ ラズマを輸送した際の磁束密度に対するソレノイド出口に おける電流波形の最大値を示しており、ソレノイド磁場の 磁束密度の増加により電流を増加させることが可能であ る. このことは他の多くのイオン種について確かめられて





図4 ソレノイドの磁束密度に対する電流の変化[13].

いる[18].一方,図4のエラーに示されるように印加する 磁場の条件によってビーム電流波形の再現性が悪化する磁 束密度や輸送距離などの条件が存在することが示されてお り、ソレノイド磁場はこの条件を避けるように設計する必 要がある.

#### 3.2 プラズマのガイディングと収束効果

これまで見てきたようにソレノイド磁場がレーザーイオ ン源の電流を増加させることを示したが、さらにソレノイ ド磁場によって得られる効果について検討する.図5はプ ラズマを長距離輸送した際の電流波形の最大値の変化がソ レノイド磁場の有無によってどのように変化するかを示し ており、輸送距離に対する電流の減少がソレノイド磁場を 用いた輸送によって小さく抑えられていることがわかる.



図5 プラズマ輸送距離に対する電流の変化[19].

これはソレノイドがプラズマをガイディングしていること を示唆しており,要求されるイオンビームのパルス幅が長 いほど,つまり,輸送距離を長くする必要があるほどソレ ノイド磁場による電流増幅は効果を発揮する.

また、一方でソレノイド磁場は短い距離でも電流の増加 が期待できる. 図6は長さ400 mm,内径47 mmのソレノ イドにレーザーアブレーションプラズマを入射した際の輸 送管中心に沿った電流のピークの変化を示しており、ソレ ノイド磁場は輸送中のガイディングのみならず、その入り 口付近でプラズマを収束させる効果を示している. このと き、磁束密度が大きいほどプラズマを収束させるまでの距 離は短く、電流は高くなることが示される.また、図7は プラズマがソレノイド磁場への入射後にソレノイド中心か ら半径方向に 0, 7, 14 mm の位置で観測した電流の変化を 示しているが、外側から中心に向かって電流が増加してい く様子がわかる. さらに短いソレノイドでも同様にその後 方でプラズマの収束効果が確認されており[21],その場合 にはソレノイドはプラズマに対してレンズのような役割を はたしていると考えられる. これらから短いソレノイドで も電流を増加させる効果があることがわかる.

#### 3.3 電流波形制御

次にソレノイド磁場による電流波形の制御の試みについ て紹介する.磁場を印加しないレーザーイオン源の典型的 なイオン電流波形に示されるように、イオン密度は時間の 関数として変化し、プラズマからイオンビームを引き出す 際のビームの発散角の時間的な変動を引き起こす. その結 果,時間的に積算されたエミッタンスは各瞬間に得られる エミッタンスと比較して増加してしまう.また,加速器全 体の空間電荷制限の設計値は、イオン源でのピーク電流を 用いて設計する必要があるため、加速器によるビーム輸送 の観点からイオンビームパルス中の電流変動は好ましくな い. これらの問題を解決するためには、パルス中のプラズ マの密度変動を制御し、フラットトップな電流波形を形成 する必要がある.著者らは図8のようにターゲット付近の プラズマ膨張領域に短いソレノイドを設置し、高速ランピ ングするパルス磁場を印加することでフラットトップの電 流波形を得るための制御を検討している[22,23]. パルス







図7 ソレノイド内の半径方向の異なる位置におけるピーク電流の変化(32 gauss)[20].

中の電流減少のタイミングに合わせて電流が増加するよう にソレノイド磁場強度を変化させることによって,図9に 示すようにビーム電流波形の整形が可能であることを確認 している.ペッパーポット法を用いてこの時のエミッタン スの変化を計測すると,測定器上でのビームの収束・発散 を示すTwiss paramterのaの値が電流に対応して変化して いることがわかる.これはプラズマからイオンビームが引 き出されるイオン放出面のメニスカスがプラズマの時間的 な密度変動によって変化することを示している.また,パ ルス磁場の適用によって現れた電流波形の2つ目のピーク と最初のピークに対応した a が同等の値を示している.こ れはパルス磁場がプラズマ密度の時間変動を低減し,パル ス中のイオン放出面のメニスカスの変化を抑えることでプ ラズマから引き出されたビームの挙動が等しくなっている ことを示唆している.これを利用することで,プラズマ密





図 9 パルス磁場によるビーム電流波形の変化および Twiss parameter a の変化.

度の変動を抑え,時間的に積分された全ビームパルスのエ ミッタンスを低減させることが可能である.この技術は, HIF のためのレーザーイオン源の実現にとって非常に重要 であり,さらに長時間にわたってフラットトップに近い電 流波形を得るため,より洗練された電流波形制御方法を検 討している.

### 4. マルチカスプ磁場印加型レーザーイオン源 4.1 プラズマガイディング効果

誘導加速器によってイオンビームを加速するスキームに レーザーイオン源を適用する場合,HIFのために十分な電 流をイオンビームに供給する方法として,図10のように細 い多数のビームを引き出し,1本のビームにマージングし て輸送するマルチビーム方式が検討されているが[24,25], 大面積のイオンビームを引き出すためには,均一なプラズ マが必要である.

プラズマを十分長い距離にわたって自然膨張させたレー ザーイオン源では横方向に対して比較的均一な分布を実現 可能である.一方で、長パルスで大電流を得るためにソレ ノイド磁場などを用いた場合には前述のようにその横方向 分布が影響を受けることが示されている.そこで、横方向 に大面積で均一な密度分布を持つプラズマのガイディング 法の確立をめざして図11のようにマイクロ波を用いるイオ ン源のプラズマ閉じ込めなどに幅広く使用されているマル チカスプ型の磁場構造をプラズマの輸送管に適用すること により、レーザーアブレーションプラズマのガイディング する方法が最近著者らによって検討されている[26,27]. この方式ではソレノイド磁場とは異なり、磁束密度をパラ メータに電流値を制御することはできないものの、ネオジ ム磁石などを用いてプラズマの輸送管内壁付近に比較的強 い磁場を容易に形成できる.

ここでは**表**1に示す二種類の磁場の条件でプラズマを輸送した際に得られたプラズマ輸送特性について紹介する. 図12(a)は**表**1(a)に対応する磁場の構成でアブレーション プラズマを輸送した際の半径方向の異なる位置(0-21 mm)における電流ピークの変化を示している.この結果 よりマルチカスプ磁場を通過中は自然な膨張時の $J \propto L^{-3}$ 



Multi-beam extraction & Acceleration

図10 マルチイオンビーム引出しの概念図.



図11 マルチカスプ磁場によるプラズマのガイディング.

の変化に比較して電流の低下が抑えられていることがわか る.また、図12(b)では電流を時間積分して得られる電荷 の距離に対する変化が示されているが、L=400 mmを過ぎ たあたりからあまり変化していないことがわかる.これ は、プラズマは進行方向のみに膨張していることを示して おり、マルチカスプ磁場によって横方向への膨張を制限し プラズマをガイディングできていることがわかる.また、 マルチカスプ磁場を用いたガイディングでは輸送管の中心 には磁場が存在しないためか、その領域を通過したプラズ マのイオン電流波形は磁場を印加しない波形と大きく変わ らず、ソレノイド磁場印加時のような電流波形の変動は生 じない.

また図13は幾つかのイオン種について表1の二種類のマ ルチカスプ磁場で輸送した際の距離に対する電流密度の変 化を示す.いずれのイオン種でも磁場ガイディング後では 自然な膨張時に得られる値より数倍の電流が得られるが, 重いイオンほど変化が緩やかに現れる傾向が見られた.

#### 4.2 半径方向の電流分布特性

最後に,二種類のマルチカスプ磁場で輸送した際のプラ ズマの半径方向分布について簡単に紹介したい.比較的小 型の構成である表1(a)のマルチカスプ磁場では良好なプ ラズマのガイディング効果が示されたが横方向に均一なプ ラズマの分布は得られていない(図12).一方,表1(b)の 条件では何れのイオン種でも(a)の条件と比較してガイ ディングの効果が現れるまで長い距離を要することが示さ れるが,マルチカスプ磁場中を輸送する間,中心軸付近で

表1 マルチカスプ磁場の構成.

	磁極数	輸送管直径[mm]	$L_1$ [mm]	$L_2$ [mm]
(a)	8	54	250	300
(b)	16	108	220	900



図12 ドリフト距離に対する(a)ピーク電流及び(b)電荷の変化 [26].

均一な分布が得られることが示唆された(図14).さらに 良好なガイディング効果を得つつ均一なプラズマの分布を 得る条件を明らかにすることは今後の課題である.

#### 5. まとめと今後の展望

従来,多価イオンの供給に用いられてきたレーザーイオ ン源であるが,HIFドライバーの開発では低価数,大電流, 低エミッタンスビームの供給という新たな課題に挑んでい る.固体密度から膨張を開始するレーザー生成プラズマを 利用するレーザーイオン源はもとより大電流イオンビーム を供給するポテンシャルを有しているが,HIFドライバー のように従来にないような大電流ビームの要求に応えるた め,さらなる高フラックス化に向けて磁場によるプラズマ の制御の試みが行われている.

ソレノイド磁場を適用したレーザーイオン源の電流は劇 的に改善され、その増倍率はソレノイドの位置、長さ、磁 東密度を変えることによって調整が可能である。一方で HIF へ向けたレーザーイオン源のさらなる制御のため、マ ルチカスプ磁場によるプラズマのガイディングを提案し、 その効果の検討が始められている。未だそのプラズマに対 する影響は未知な部分が多く残されているものの、マルチ カスプ磁場を通して輸送した際のアブレーションプラズマ の基本的な振る舞いは明らかになりつつあり、磁場による ガイディング効果が実証されつつある。さらに目的に応じ



図13 ドリフト距離に対するピーク電流の変化(a) small multicusp (b) large multicusp[27].



図14 マルチカスプ磁場ガイディング中の Cu プラズマの横方向 の電流密度分布[28].

てソレノイド磁場とマルチカスプ磁場によるガイディング の方法を使い分け,あるいは組み合わせることで所望のパ ラメータを実現するレーザーイオン源の構築が可能となる であろう.

大電流重イオンビームの形成は歴史的に困難であったた めか,現在その用途も原子核物理学実験への応用や粒子線 治療などあまり多くはない.しかし,近年のレーザー技術 の進歩により商用のテーブルトップのものでも高繰り返し で安定したレーザーを発生できるものが普及してきてお り、レーザーイオン源は比較的簡単に構築が可能となって いる.また、単純な構成で高輝度のイオンビームを供給で きるため、大規模施設だけでなく小型加速器にも適合し多 くの加速器施設で採用できる可能性があり、今後 HIF に限 らず様々な重イオンビームの用途に応用されることを期待 している.

#### 参 考 文 献

- [1]小特集「重イオン慣性核融合のためのエネルギードラ イバー開発の進展」:プラズマ・核融合学会誌 89,87 (2013).
- [2] N.J. Peacock et al., J. Appl. Phys. 2, 1705 (1969).
- [3] M. Dembinski et al., J. Appl. Phys. 50, 6113 (1979).
- [4] G. Jaffe, Phys. Rev. 65, 91 (1944).
- [5] H. Riege, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A 451, 394 (2000).
- [6] S. Liu et al., J. Appl. Phys. 78, 5919 (1995).
- [7] A. Balabaev *et al.*, Rev. Sci. Instrum. **75**, 1572 (2004).
- [8] B. Yu. Sharkov, et al., Rev. Sci. Instrum. 69, 1035 (1998).
- [9] V.Y. Baranov et al., Laser Part. Beams 14, 347 (1996).
- [10] B. Sharkov et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 33, 1778 (2005).
- [11] H.Y. Zhao et al., Rev. Sci. Instrum. 87, 02A917 (2016).
- [12] T. Kanesue et al., Proc. EPAC08, Genoa, Italy, 421 (2008).



- [13] M. Okamura *et al.*, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A **733**, 97 (2014).
- [14] J. Tamura et al., Rev. Sci. Instrum. 79, 02B101 (2008).
- [15] M. Sekine *et al.*, Rev. Sci. Instrum. **83**, 02B318 (2012).
- [16] M. Okamura et al., Rev. Sci. Instrum. 87, 02A906 (2016).
- [17] M. Okamura *et al.*, Proceedings of NAPAC2016, MOA 4IO01 (2016).
- [18] S. Ikeda et al., Rev. Sci. Instrum. 87, 02A915 (2016).
- [19] K. Takahashi et al., AIP Conf. Proc. 1525, 241 (2013).
- [20] 高橋一匡 他:電気学会パルスパワー研究会資料, PPT-13-040 (2013).
- [21] S. Ikeda et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 43, 3456 (2015).
- [22] M. Sekine *et al.*, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A **795**, 151 (2015).
- [23] M. Okamura et al., Laser Part. Beams 33, 137 (2015).
- [24] D.P. Grote *et al.*, Phys. Rev. Special Topics Accel. Beams 6, 014202 (2003).
- [25] J.W. Kwan, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 464, 397 (2001).
- [26] K. Takahashi et al., J. Phys. Conf. Series 717,012113 (2016).
- [27] K. Takahashi et al., Energy Procedia 131C, 354 (2017).
- [28] K. Takahashi et al., (submitted).

